

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОМА 41, 2012 г.

| | | |
|---|---|---------|
| <i>Абдурахманов Б.А., Илиев Х.М., Тачилин С.А., Тошев А.Р.</i> , Кремниевые солнечные элементы с Si–Ge микрогетеропереходами | 3 | 188–190 |
| <i>Абрамов И.И., Коломейцева Н.В., Романова И.А.</i> , Комбинированные двухзонные модели резонансно-туннельных диодов | 5 | 373–382 |
| <i>Альзоба В.В., Данилова М.А., Кузин А.Ю., Митюхляев В.Б., Раков А.В., Тодуа П.А., Филиппов М.Н.</i> , Оценка нелинейности сканирования на растровом электронном микроскопе | 6 | 430–432 |
| <i>Аракелов К.С.</i> , Моделирование дифракции материальной волны в поле двух кулоновских центров в квазиклассическом приближении | 3 | 225–232 |
| <i>Арыков В.С., Гаврилова А.М., Дедкова О.А., Кагадей В.А., Лиленко Ю.В.</i> , Формирование субмикронного затвора GaAs ПТШ с использованием четырехслойного диэлектрического макета | 3 | 181–187 |
| <i>Бакеренков А.С., Беляков В.В., Першенков В.С., Романенко А.А., Савченков Д.В., Шуренков В.В.</i> , Экстракция подстроечных параметров конверсионной модели эффекта низкой интенсивности в биполярных приборах | 6 | 445–449 |
| <i>Баринцов С.М., Светцов В.И., Ефремов А.М.</i> , Исследование кинетики полимеризационных процессов в плазме метана методом электрических зондов | 6 | 409–412 |
| <i>Бахадырханов М.К., Исамов С.Б., Зикриллаев Н.Ф.</i> , Фотоприемники ИК-излучения в области $\lambda = 1.5\text{--}8$ мкм на основе кремния с многозарядными нанокластерами атомов марганца | 6 | 433–435 |
| <i>Бибило П.Н., Кириенко Н.А.</i> , Оценка энергопотребления логических КМОП-схем по их переключательной активности | 1 | 65–77 |
| <i>Бобровский Д.В., Калашников О.А., Некрасов П.В.</i> , Оценка чувствительности ПЛИС к эффектам воздействия отдельных ядерных частиц | 4 | 248–252 |
| <i>Богданов Ю.И., Лукичёв В.Ф., Нуяззин С.А., Орликовский А.А.</i> , Квантовые шумы и контроль качества элементной базы квантовых компьютеров на сверхпроводниковых фазовых кубитах | 6 | 387–398 |
| <i>Боруздина А.Б., Уланова А.В., Григорьев Н.Г., Никифоров А.Ю.</i> , Дозовая деградация динамических параметров микросхем памяти | 4 | 284–290 |
| <i>Бухараев А.А., Бизяев Д.А., Нургазизов Н.И., Ханипов Т.Ф.</i> , Получение магнитных микро- и наноструктур методом сканирующей зондовой литографии | 2 | 90–97 |
| <i>Власов А.О., Евлампиев Б.Е., Кириченко П.Г., Кочнов А.А.</i> , Оптимизация маршрута проектирования системы “К64-РИО”, на кристалле изготовленной по технологии 0.18 мкм | 3 | 233–240 |
| <i>Воробьева А.И., Шулицкий Б.Г.</i> , Ориентированные углеродные трубки, синтезированные с использованием пористого оксида алюминия | 5 | 315–323 |
| <i>Глушко А.А., Шахнов В.А.</i> , Особенности трехмерного моделирования КНИ МОП-транзисторов с непрямым затвором | 2 | 83–89 |
| <i>Джадан М., Челябинский А.Р., Явид В.Ю.</i> , Влияние радиационных дефектов на диффузию мышьяка и сурьмы в имплантированном кремнии | 2 | 98–103 |
| <i>Драгунов В.П., Остертак Д.И.</i> , Микроэлектромеханические преобразователи | 2 | 120–135 |
| <i>Елесин В.В., Назарова Г.Н., Чуков Г.В., Кабальнов Ю.А., Титаренко А.А.</i> , Исследование возможности разработки радиационно-стойких БИС навигационного назначения по отечественной КМОП КНИ технологии с нормами 0.35 мкм | 4 | 291–303 |

| | | |
|--|---|---------|
| <i>Ерофеев Е.В., Кагадей В.А.</i> , Особенности формирования низкорезистивного Ge/Au/Ni/Ti/Au омического контакта к <i>n-i</i> -GaAs | 3 | 200–207 |
| <i>Ефремов А.М., Давлятина А.А., Светцов В.И.</i> , Электрофизические параметры и состав плазмы HCl–O ₂ | 6 | 399–408 |
| <i>Жуков В.А., Маслов В.Г.</i> , ВАХ и ширина спектра при туннелировании электронов сквозь наносэндвичи W–WO ₂ –(Au ₁₄₇ ⁻)–Al ₂ O ₃ –Al и Nd–Nd ₂ O ₃ –(Au ₅₅ ⁻)–Nd ₂ O ₃ –Nd. Часть I: квантово-химический расчет энергий орбиталей анионов нанокластеров Au ₅₅ и Au ₁₄₇ | 2 | 136–145 |
| <i>Жуков В.А., Маслов В.Г.</i> , ВАХ и ширина спектра при туннелировании электронов сквозь наносэндвичи W–WO ₂ –(Au ₁₄₇ ⁻)–Al ₂ O ₃ –Al и Nd–Nd ₂ O ₃ –(Au ₅₅ ⁻)–Nd ₂ O ₃ –Nd. Часть II: построение и исследование 1D моделей для 3D наносэндвичей | 3 | 191–199 |
| <i>Жуков В.А., Шпартыко П.В.</i> , Электронно-оптические свойства заряженных конических диэлектрических колец | 5 | 340–350 |
| <i>Залуцкая А.А., Проказников А.В.</i> , Расщепление краевых мод в наносистемах | 5 | 331–339 |
| <i>Кальнов В.А., Новиков Ю.А., Орликовский А.А.</i> , Работа электронного литографа в режиме растрового электронного микроскопа | 6 | 426–429 |
| <i>Карасёв В.Ю., Пинтус С.М., Алтухов А.А., Белов Б.А., Гладченков Е.В.</i> , Трансформация формы природных кристаллов алмаза при активации неравновесных процессов | 5 | 324–330 |
| <i>Катунин Ю.В., Стенин В.Я.</i> , Моделирование эффектов локальных воздействий ядерных частиц на 65 нм КМОП элементы двухфазной логики | 4 | 262–274 |
| <i>Кессаринский Л.Н., Бойченко Д.В., Никифоров А.Ю.</i> , Анализ радиационного поведения импульсных стабилизаторов напряжения | 4 | 275–283 |
| <i>Коноплев Б.Г., Агеев О.А., Смирнов В.А., Коломийцев А.С., Сербу Н.И.</i> , Модификация зондов для сканирующей зондовой микроскопии методом фокусированных ионных пучков | 1 | 47–56 |
| <i>Краснюк А.А., Петров К.А.</i> , Особенности применения помехоустойчивого кодирования в СУБ-100 нм микросхемах памяти для космических систем | 6 | 450–456 |
| <i>Кухарев А.В., Данилюк А.Л., Борисенко В.Е.</i> , Колебания намагниченности в наноструктуре ферромагнетик/немагнитный металл/ферромагнетик под действием поляризованного по спину тока | 1 | 9–19 |
| <i>Латышев А.В., Юшканов А.А.</i> , Взаимодействие электромагнитной Н-волны с тонкой металлической пленкой | 1 | 30–35 |
| <i>Ломов А.А., Чуев М.А., Балин В.А., Набатов Б.В., Васильев А.Л.</i> , Характеризация структуры и оптических свойств микронных пористых слоев на подложках легированного сурьмой кремния | 6 | 413–425 |
| <i>Масальский Н.В.</i> , Оптимизация параметров двухзатворных суб-20 нм КНИ КМОП транзисторов с архитектурой “без перекрытия” | 1 | 57–64 |
| <i>Масальский Н.В.</i> , Характеристики двух затворных КНИ КМОП нанотранзисторов для перспективных технологий с низким уровнем потребляемой мощности | 6 | 436–444 |
| <i>Махвиладзе Т.М., Минушев А.Х., Сарычев М.Е.</i> , Неэмпирическое моделирование процессов химического осаждения пленок нитрида кремния в CVD реакторах | 3 | 215–224 |
| <i>Мордвинцев В.М.</i> , Энергонезависимая электрически перепрограммируемая память на самоформирующихся проводящих наноструктурах с кроссбар-архитектурой | 5 | 351–363 |
| <i>Мятев А.А., Кречетов И.С., Петренко П.А.</i> , Получение тонких пленок оксидов Ti, La, Pb, Cd, Mn, Zr и Y на сложной поверхности травленной алюминиевой фольги для электролитических конденсаторов методом пиролиза солей органических кислот | 3 | 208–214 |
| <i>Ольчев С.И., Стенин В.Я.</i> , Характеристики чувствительности субмикронных двухфазных КМОП инверторов к воздействию отдельных ядерных частиц | 2 | 146–160 |

| | | |
|---|---|---------|
| <i>Преснов Д.Е., Амитонов С.В., Крупенин В.А.</i> , Полевой транзистор с каналом-нанопроводом на основе кремния на изоляторе | 5 | 364–367 |
| <i>Пузанов А.С., Оболенский С.В.</i> , Особенности переноса электронов в биполярных транзисторных структурах с тонкой базой при воздействии потока квантов высоких энергий | 4 | 304–312 |
| <i>Рудаков В.И., Овчаров В.В., Пригара В.П.</i> , Влияние оптических свойств КНИ-структуры на температуру пластины при быстром термическом отжиге | 1 | 20–29 |
| <i>Скворцов А.А., Орлов А.М., Зувев С.М.</i> , К вопросу диагностики деградационных процессов в системе металл–полупроводник | 1 | 36–46 |
| <i>Стенин В.Я., Степанов П.В.</i> , Моделирование локального воздействия ядерных частиц на 65 нм КМОП ячейки памяти DICE | 4 | 253–261 |
| <i>Федичкин Л., Борисов А., Конин А., Петрухненко Р., Чернышев М., Рубаев В.</i> , Влияние квантовых эффектов на электронный транспорт в молибденовых наноконтактах | 1 | 5–8 |
| <i>Цуканов А.В.</i> , NV-центры в алмазе. Часть I. Общие сведения, технология изготовления, структура спектра | 2 | 104–119 |
| <i>Цуканов А.В.</i> , NV-центры в алмазе. Часть II: спектроскопия, измерения, квантовые операции | 3 | 163–180 |
| <i>Чумаков А.И., Васильев А.Л., Печенкин А.А., Савченков Д.В., Тарараксин А.С., Яненко А.В.</i> , Совместное использование лазерной и импульсной гамма-установок при оценке параметров чувствительности БИС к эффектам воздействия отдельных ядерных частиц | 4 | 243–247 |
| <i>Юрьев В.А., Арапкина Л.В., Чиж К.В., Войтик М.Г., Чапнин В.А., Калинушкин В.П.</i> , Температурный коэффициент сопротивления пленок поликристаллического SiGe | 5 | 368–372 |
| Памяти Татевоса Мамиконовича Агаханяна | 1 | 3–4 |
| Авторский указатель тома 40, 2011 г. | 1 | 78–80 |
| Вниманию авторов | 5 | 383–384 |